

Микроскоп сверхвысокого разрешения

N-SIM/N-STORM



Увидеть так, как никогда раньше п-ым/п-ытокм

Микроскопы сверхвысокого разрешения Nikon переносят ваши исследования в мир наноскопии за дифракционным пределом.

Новый микроскоп сверхвысокого разрешения Nikon N-SIM/N-STORM дает возможность исследовать структуру и функции живых клеток на нано уровне.

Разрешение традиционных оптических микроскопов, даже оснащенных объективами с высокой числовой апертурой, ограничено дифракцией и составляет не более 200 нм.

Используя высокочастотное структурированное освещение, микроскоп Nikon N-SIM может обеспечить разрешение до 85 нм*, что ранее считалось невозможным для оптических микроскопов. Кроме того, при временной разрешающей способности до 0,6 сек/кадр**, микроскоп N-SIM обеспечивает съемку со сверхвысоким разрешением динамических процессов молекулярного взаимодействия в живых клетках. Наблюдение подобной динамики в таком разрешении может открыть перед учеными новые миры.

Микроскоп N-STORM использует временное разрешения для увеличения пространственного разрешения, что позволяет достичь разрешения порядка 20 нм, что в 10 и более раз превышает способность обычных оптических микроскопов. С использованием микроскопии стохастической оптической реконструкции (STORM) стало возможным исследовать взаимодействие между белками на молекулярном уровне. Микроскопы сверхвысокого разрешения Nikon просты в использовании, хотя и основаны на мощных технологических разработках компании.

N-SIM и N-STORM существенно повышают возможность решения задач в области наноскопии и придают уверенность в правильности выводов, которые можно сделать на основе полученных данных.

* При возбуждении лазером 488 нм, в режиме TIRF-SIM

**В режиме 2D-SIM/TIRF-SIM

Оовчный микроскоп

Микроскоп N-SIM (режим 3U-SII

Микротрубочки в клетке меланомы В16, меченные YFP Объектив: CFI Аро TIRF 100х оі! (NA 1,49) Скорость захвата изображения: около 1,8 сек/кадр Сфотографировано в сотрудничестве с: Ясуши Окада (Yasushi Okada), Ph.D., Факультет клеточно

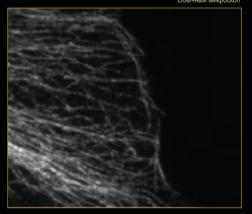
Обычный микроскоп

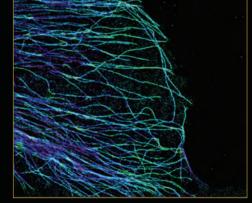
Микроскоп N-SIM (режим 3D-SIM)

Эндоплазматический ретикулум (ЭР) в живой клетке HeLa, меченной GFP
Объектив: CFI Apo TIRF 100x oil (NA 1,49) Скорость захвата изображения: около 1,5 сек/кадр
Сфотографировано в сотрудничестве с: Икуо Вада (Ikuo Wada), Ph.D., Институт биомедицинских наук
Медицинский факультет университета Фукушимы

обеспечить разрешающей решением динамических мики

о разрешения ность разоваем в такум по должно в та





Микротрубочка, меченая флуоресцентным красителе

2



— — Временное разрешение 0,6 сек/кадр позволяет осуществить съемку со сверхвысоким разрешением динамических процессов в живых к со сверхвысоким разрешением динамических процессов в живых клетках

В микроскопии структурированного освещения неизвестная клеточная наноструктура изучается путем анализа муарового рисунка, появляющегося при освещении образца высокочастотным структурированным излучением.

Микроскопия структурированного освещения Nikon (N-SIM) обеспечивает сверхвысокое разрешение до 85 нм в нескольких цветах. Кроме того, она позволяет осуществлять непрерывную съемку со сверхвысоким разрешением со скоростью 0,6 сек/кадр, делая возможным исследование динамических взаимодействий в живых клетках.

Изображение живых клеток при разрешении в два раза превышающем (до приблизительно 85 нм) разрешение обычного оптического микроскопа

В микроскопе сверхвысокого разрешения N-SIM используется инновационный подход компании Nikon к технологии "микроскопии структурированного

Сочетая эту мощную технологию с использованием высокоапертурного объектива Nikon CFI Apo TIRF 100x oil (NA 1,49), микроскоп N-SIM обеспечивает пространственное разрешение почти в два раза превышающее разрешение обычных оптических микроскопов (до приблизительно 85 нм*) и позволяет получить наглядное представление о мельчайших межклеточных структурах и их взаимодействии.

*При возбуждении лазером 488 нм, в режиме TIRF-SIM

Скорость захвата изображения 0.6 сек/кадр - удивительно быстрый микроскоп сверхвысокого разрешения

Микроскоп N-SIM обеспечивает сверхбыстрое получение изображений с использованием технологии структурированного освещения. Временное разрешение составляет до 0,6 сек/кадр, что позволяет получать изображения живых клеток (в режиме TIRF-SIM/2D-SIM; получение изображений с временным разрешением до приблизительно 1 сек/кадр возможно в режиме 3D-SIM).

Различные режимы наблюдения

Режим TIRF-SIM/2D-SIM

Этот режим обеспечивает получение двумерных изображений сверхвысокого разрешения на высокой скорости и с невероятно высокой контрастностью. Режим TIRF-SIM использует преимущества наблюдения при флуоресценции полного внутреннего отражения с разрешением в два раза превышающим разрешение обычных микроскопов TIRF, что позволяет лучше понять взаимодействие молекул на поверхности клетки.

Наблюдение с использованием микроскопа N-SIM при сверхвысоким аксиальном разрешении обеспечивает получение оптического среза образцов при разрешении 300 нм в клетках и тканях толщиной до 20µм. Кроме того, в режиме 3D SIM устраняется фоновая флуоресценция, что позволяет получить высококонтрастное изображение.

Возможность установки до 5 различных лазеров

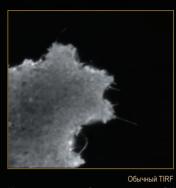
Модуль Nikon LU-5 - это система предусматривающая установку до 5 различных лазеров, обеспечивающая естественное многоцветное изображение со сверхвысоким разрешением. Реальная цветопередача является существенной при исследовании динамического взаимодействия различных белков на молекулярном уровне.





Объектив: CFI Apo TIRF 100x oil (NA 1,49)

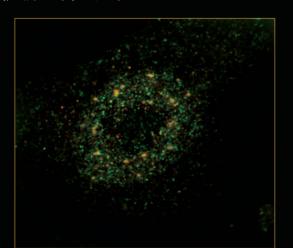
ость захвата изображений: около 1,8 сек/кадр тографировано в сотрудничестве с: Ясуши Окада (Yasushi Okada), Ph.D., Факультет клеточной

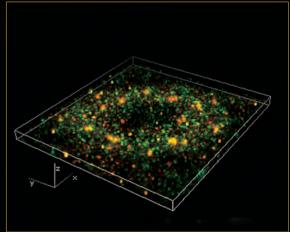


Режим TIRF-SIM

ана клетки меланомы В16. меченая желтым флуоресцентным белком Объектив: CFI Apo TIRF 100x oil (ЧА 1,49)

Сфотографировано в сотрудничестве с: Ясуши Окада Yasushi Okada), Ph.D., Факультет клеточной биологии





3D-реконструкция изображения толшиной приблизительно 5µм (часть)

олокализованные изображения исследуемого белка VGEF (Cy3) и его E3 убиквитин-лигазы E3 (FITC)

Объектив: CFI Apo TIRF 100x oil (NA 1,49)

Сфотографировано в сотрудничестве с: Хидетака Онуки (Hidetaka Ohnuki), Ph.D., Шигеки Хигашияма (Shigeki

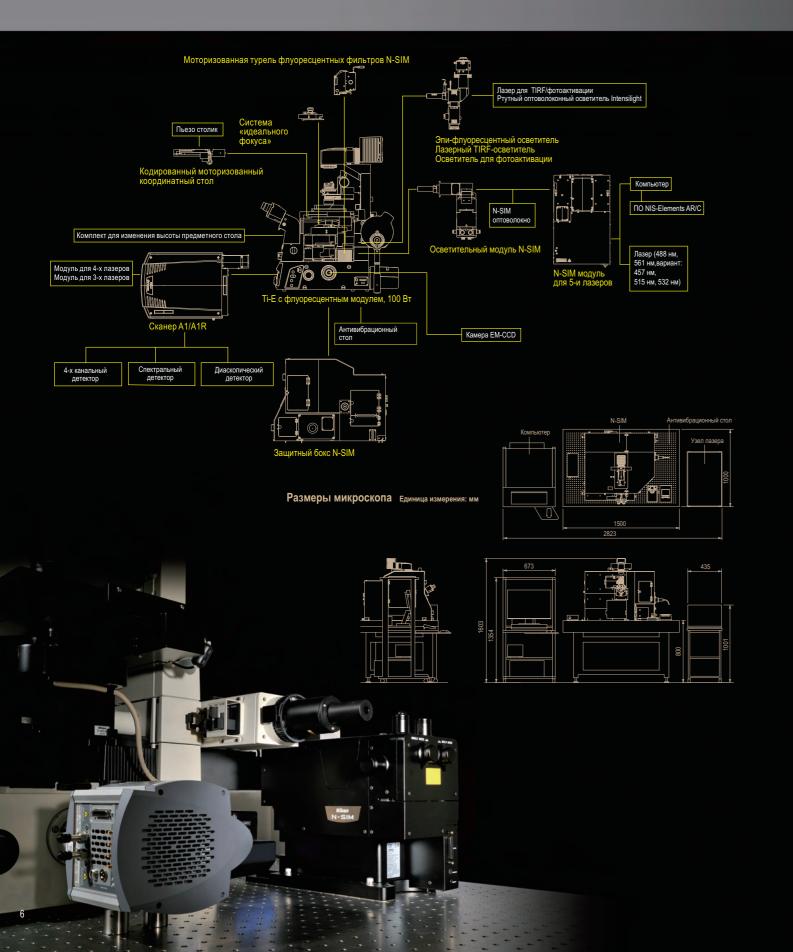






тив: CFI Apo TIRF 100x oil (NA 1,49)

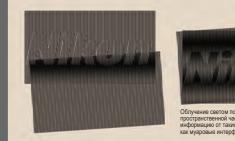
N-SIM



Принципы микроскопии структурированного освещения

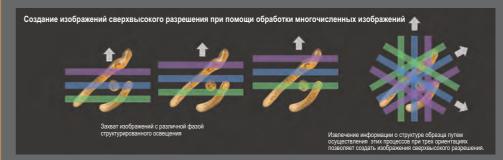
Аналитическая обработка записанных муаровых изображений с помощью математических методов позволяет восстановить структуру образца со сверхвысоким разрешением.

Использование лазерной интерференции высоких пространственных частот для освещения структуры внутри образца дает муаровые интерференционные полосы, которые фиксируются. Эти муаровые интерференционные полосы включают модулированную информацию о структуре образца с более высоким разрешением. В процессе обработки изображения эта информация восстанавливается, что позволяет достичь разрешения, превышающего разрешение обычных оптических микроскопов.





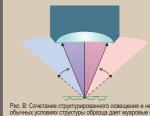
Муаровые изображения содержат информацию о мельчайших структурах внутри образца. Фиксируются многочисленные фазы и ориентации структурированного освещения, а информация "сверхвысокого разрешения" извлекается из муаровых интерференционных полос. Эта информация комбинируется математически в "Фурье-пространстве" или апертурном пространстве, затем трансформируется обратно в пространство изображения, что позволяет получить изображение с разрешением в два раза превышающим обычный предел.



Захват информации высокого разрешения, высокой пространственной частоты ограничен числовой апертурой (NA) объективов, и пространственные частоты структуры за пределами апертуры оптической системы не фиксируются (Рис. A). Освещение образца высокочастотным структурированным излучением, которое позволяет получить изображение со свервысоким разрешением в пределах апертуры оптической системы (Рис. B).

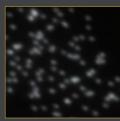
Когда эта информация о "сверхвысоком разрешении" математически комбинируется со стандартной информацией, полученной посредством линз объектива, результатом становится удвоение значения NA и, соответственно, разрешения оптической системы (Рис. С).



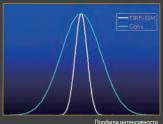


Сравнение изображений: микроскоп в режиме TIRF-SIM и обычный микроскоп

Изображения флуоресцирующих точек диаметром 100 нм, зафиксированные обычным микроскопом и микроскопом сверхвысокого разрешения N-SIM. Профили интенсивности точечных изображений указывают, что разрешающая сила микроскопа сверхвысокого разрешения почти в два раза превышает разрешающую силу обычного эпи-флуоресцентного







TIRF-SIM

— — — — Достижение разрешения, превышающего разрешение обычного оптического микроскопа в 10 раз, позволяет проводить исследования на молекулярном уровне

Микроскопия стохастической оптической реконструкции (STORM) позволяет реконструировать флуоресцентное изображение со сверхвысоким разрешением при помощи объединения информации о точной локализации каждого флуорофора в образце. В микроскопе N-STORM применяется высокоточная многоканальная молекулярная локализация и реконструкция, полностью используя преимущества мощного инвертированного микроскопа Nikon Ti-E, что позволяет получить сверхвысокое разрешение, превышающее в 10 раз (приблизительно 20 нм в горизонтальной плоскости) разрешение обычных микроскопов.

Эта мощная технология позволяет изучать молекулярное взаимодействие в нано-диапазоне, открывая новые миры для исследований.

Сверхвысокое разрешение в 10 раз (приблизительно 20 нм в горизонтальной плоскости) превышающее разрешение обычных оптических микроскопов

Микроскоп N-STORM использует высокоточную информацию о локализации (двумерную или трехмерную) от нескольких тысяч отдельных молекул-флуорофоров в образце - это позволяет создавать удивительные изображения со сверхвысоким разрешением превышающим в 10 раз разрешение обычных оптических микроскопов.

N-STORM также способен создавать и аксиальное изображение с разрешением в 10 раз превышающим обычное оптическое разрешение (приблизительно 50 нм)

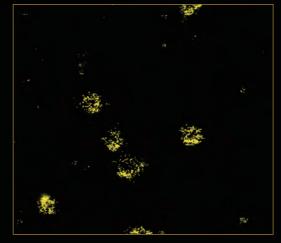
Помимо латерального сверхвысокого разрешения, N-STORM использует патентованные методы для достижения 10-кратного улучшения аксиального разрешения, предоставляя трехмерную информацию в наноскопическом масштабе.

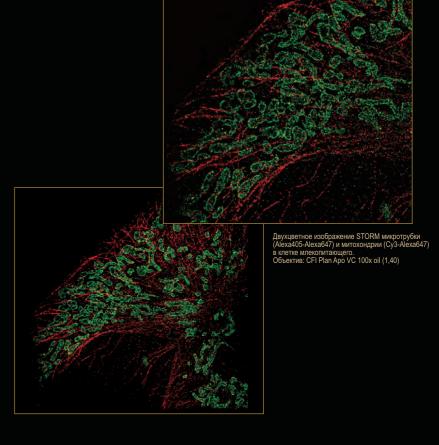
Многоцветное изображение с использованием различных флуоресцирующих зондов

Получение многоцветных изображений со сверхвысоким разрешением возможно благодаря комбинированию различных зондов - "активаторов" и "репортеров".

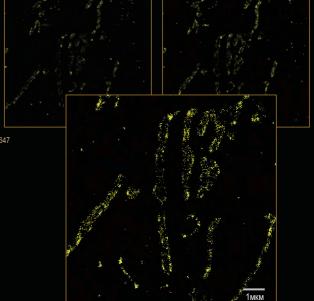
Таким образом становится возможным получение важной информации о колокализации и взаимодействии многочисленных белков на молекулярном уровне.



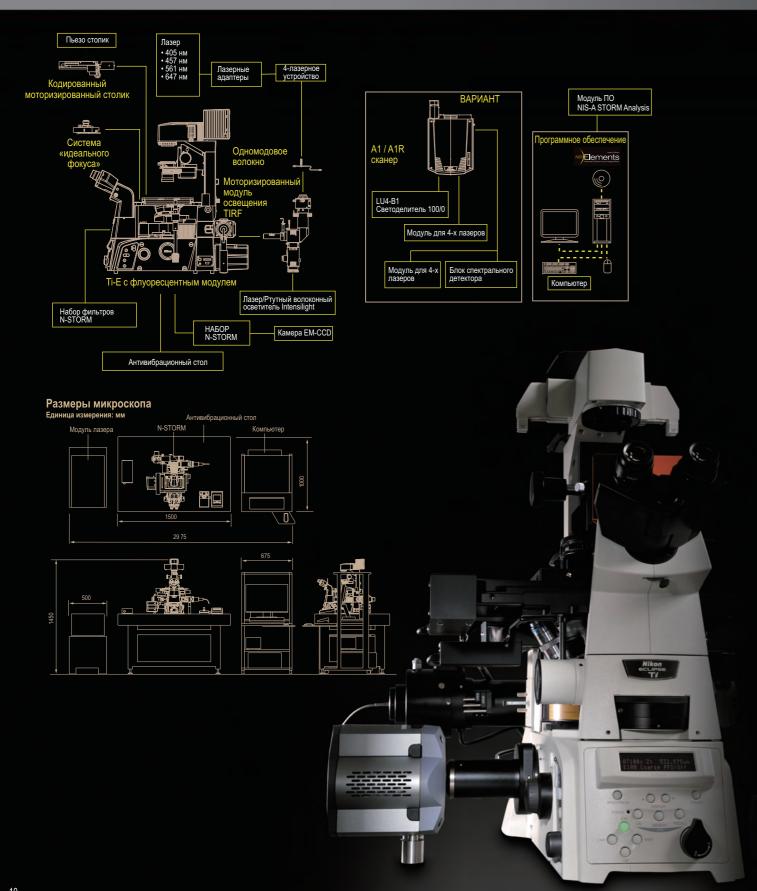








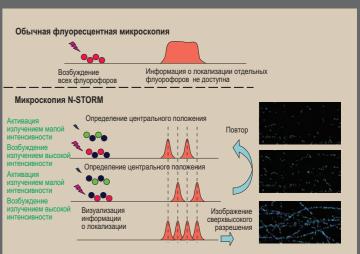
N-STORM



Принцип работы N-STORM (микроскопия стохастической оптической реконструкции)

При микроскопии стохастической оптической реконструкции (STORM) изображение сверхвысокого разрешения реконструируется путем сбора высокоточной информации о локализации каждого флуорофора в трех измерениях и различных цветах

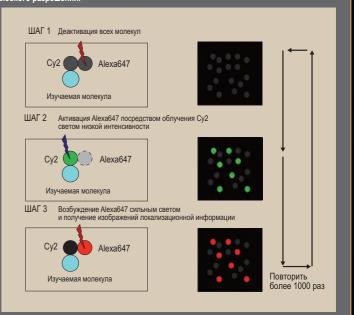
В N-STORM используется стохастическая активация относительно небольшого количества молекул флуорофора с использованием очень малоинтенсивного света. Эта малоинтенсивная стохастическая "активация" отдельных молекул позволяет достичь высокоточного определения положения каждой молекулы в горизонтальной плоскости. Кроме того, используя преимущество искусственного астигматизма, полученного посредством специальной оптики 3D-STORM, N-STORM локализует каждую молекулу в вертикальной плоскости. Комбинирование путем вычислений молекулярных координат в трех измерениях приводит к получению высококонтрастных трехмерных изображений.



Специализированные флуоресцентные красители

При работе с N-STORM используются пары специализированных флуоресцентных красителей содержащие "активатор" (возбуждение в относительно коротковолновой области спектра), что позволяет получить различные цветовые комбинации, упрощая достижение истинного многоканального сверхвысокого разрешения.





Технические характеристики

	N-SIM	N-STORM
Разрешение по ХҮ	Приблизительно 100 нм (до 85 нм: теоретически, в режиме TIRF-SIM, 488-нм возбуждение)	Приблизительно 20 нм
Разрешение по оси Z	Приблизительно 300 нм	Приблизительно 50 нм
Скорость захвата изображения	До 0,6 сек/кадр (TIRF-SIM/2D-SIM) До 1 сек (3D-SIM) (необходимо еще 1-2 сек для подсчета)	10 минут или более
Режим получения изображений	TIRF-SIM (сверхвысокое разрешение TIRF XY) 2D-SIM (сверхвысокое разрешение по осям XY, до 3µм вглубь) 3D-SIM (сверхвысокое разрешение по осям XYZ, до 20µм вглубь)	TIRF-STORM 3D STORM
Многоцветные изображения	До 5 цветов	2 цвета одновременно
Совместимый лазер	Стандарт: 488 нм, 561 нм Опционнот: 457 нм, 515 нм, 532 нм	405 нм, 457 нм, 561 нм, 647 нм
Совместимые микроскопы	Моторизованный инвертированный микроскоп ECLIPSE Ti-E Система «идеального фокуса» Кодированный моторизированный ХҮ стол Пьезо столик	
Объективы:	CFI Apo TIRF 100x oil (YA 1,49) CFI Plan Apo IR 60× WI (YA 1,27)	CFI Apo TIRF 100x oil (YA 1,49) CFI Plan Apo VC 100x oil (YA 1,40)
Камера	Камера Andor Technology iXon DU897 EMCCD	
Программное обеспечение	NIS-Elements AR/ NIS-Elements C (с конфокальным микроскопом A1)	NIS-Elements AR/ NIS-Elements C (с конфокальным микроскопом A1)
Рекомендуемые условия	25 C±0.5 C	от 20 С до 25 С (± 0.5 С)



Фото на обложке (внизу) выполнено в сотрудничестве с: Хидетака Онуки, Ph.D., Шигеки Хигашияма, Ph.D., Университет Эхиме, Магистратура медицины

Технические характеристики и оборудование могут быть изменены без какого-либо уведомления. Производитель не несет ответственности за эти изменения. Сентябрь 2010 ©2010 NIKON CORPORATION



ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ.

Изображения мониторов смоделированы.
Названия компаний и продуктов, появляющиеся в данной брошюре, являются зарегистрированными товарными знаками
или торговыми марками.

N.B.: Экспорт продукций, упомянутой в данной брошюре, контролируется. Законодательством Японии по иностранной валюте
и международной торговле. В случае экспорта из Японии, необходимо соблюдать соответствующие экспортные процедуры.
"Продукция: Аппаратное обеспечение и техническая информация к нему (включая программное обеспечение)











NIKON CORPORATION

Shin-Yurakucho Bidg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Телефон в Японии: +81-3-3216-2375 факс: +81-3-3216-2385 http://www.nikon.com/instruments/



ООО «БиоГен-Аналитика»

115093, Москва, Партийный пер., д.1, корп. 58, стр.1 тел./факс: +7 499 704 62 44 e-mail: 84997046244@bga.su www.bga.su